

Dostawa fabrycznie nowego mikroskopu badawczego STM/AFM z rozszerzoną gwarancją oraz szkoleniem instruktażowym dla Laboratorium Nanomateriałów w ramach Projektu "Centrum Zaawansowanych Technologii Pomorza"

Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352) 29 29-42670

E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze on-line: <http://simap.europa.eu>**OGŁOSZENIE DODATKOWYCH INFORMACJI, INFORMACJE O NIEKOMPLETNEJ PROCEDURZE LUB SPROSTOWANIE**

Uwaga: Jeżeli sprostowanie lub dodanie informacji prowadzi do znaczącej zmiany warunków określonych w pierwotnym ogłoszeniu o zamówieniu, konieczne może okazać się przedłużenie początkowo przewidzianych terminów ze względu na zachowanie zasady równego traktowania oraz warunków konkurencyjności zamówienia.

SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJĄCA**I.1) NAZWA, ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE****Oficjalna nazwa:** Politechnika Gdańska**Adres pocztowy:** ul. G. Narutowicza 11/12**Miejscowość:** Gdańsk**Kod pocztowy:** 80-233**Kraj:** Polska**Punkt kontaktowy:** Skrzydło "B" Gmachu Głównego, ul. G. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk, pok. 206**Tel.:** +48 58 347 20 39**Osoba do kontaktów:** Joanna Jackiewicz-Paprocka**E-mail:** joanna.jackiewicz@pg.gda.pl**Faks:** + 48 58 347 29 13**Adres(y) internetowy(e) (jeżeli dotyczy)**Ogólny adres instytucji zamawiającej (URL): <http://www.pg.gda.pl>

Adres profilu nabywcy (URL):

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO **Instytucja zamawiająca** (w przypadku zamówienia objętego przepisami dyrektywy 2004/18/WE) **Podmiot zamawiający** (w przypadku zamówienia objętego przepisami dyrektywy 2004/17/WE – Zamówienia sektorowe)

Dostawa fabrycznie nowego mikroskopu badawczego STM/AFM z rozszerzoną gwarancją oraz szkoleniem instruktażowym dla Laboratorium Nanomateriałów w ramach Projektu "Centrum Zaawansowanych Technologii Pomorze" SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą (podano w pierwotnym ogłoszeniu)

Dostawa fabrycznie nowego mikroskopu badawczego STM/AFM z rozszerzoną gwarancją oraz szkoleniem instruktażowym dla Laboratorium Nanomateriałów w ramach Projektu "Centrum Zaawansowanych Technologii Pomorze"

II.1.2) Krótki opis (podano w pierwotnym ogłoszeniu)

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego mikroskopu badawczego STM/AFM z rozszerzoną gwarancją oraz szkoleniem instruktażowym dla Laboratorium Nanomateriałów w ramach Projektu „Centrum Zaawansowanych Technologii POMORZE”.

Na przedmiot zamówienia składa się:

- mikroskop sił atomowych (AFM)
- mikroskop tunelowy (STM)
- dodatkowe oprzyrządowanie i oprogramowanie

Parametry bezwzględnie wymagane

1. Tryb obrazowania ogólnego zastosowania o następujących cechach:

możliwość pracy w powietrzu oraz w cieczach

automatyczna kalibracja częstotliwości rezonansowej dźwigni

2. Mikroskopia sił atomowych (w trybie statycznym i z rezonansowo drgającą belką)

3. Obrazowanie fazowe

4. Spektroskopia sił atomowych w funkcji odległości ostrze-powierzchnia

5. Mikroskopia sił tarcia (lateralnych)

6. Mikroskopia sił elektrostatycznych w trybie z dwukrotnym przejściem danej linii, mającym na celu odseparowanie informacji o topografii powierzchni od pomiarów pola elektrostatycznego.

7. Mikroskopia sił magnetycznych

8. Mikroskopia potencjału powierzchniowego (sonda Kelvina)

9. Skaningowa mikroskopia tunelowa

10. Zintegrowany mikroskop optyczny o rozdzielczości min. 1 mikrometr

ROZBUDOWA SYSTEMU O NASTĘPUJĄCE OPCJE:

Dodatkowe parametry pożądane (punktowane):

1. Mikroskopia sił magnetycznych – pomiar amplitudy, fazy pola magnetycznego w trybie z dwukrotnym przejściem danej linii, mającym na celu odseparowanie informacji o topografii powierzchni od pomiarów pola magnetycznego.

2. Nanoindentacja, Uwaga: opcje analizy składowych harmonicznych oraz tryby obrazowania dual/multi frequency AC nie będą rozważane jako równoważne.

3. Mikroskopia pojemnościowa w trybie dC/dZ oraz dC/Dv

4. Mikroskopia rezystancji rozplywu z zastosowaniem wzmacniacza logarytmicznego

5. Możliwość obrazowania w podwyższonych temperaturach w zakresie do 150 °C.

6. Możliwość obrazowania w obniżonych temperaturach do -35 °C

7. Moduł próżniowy (próżnia bezolejowa do 10⁻⁴Tr)

8. Nanolitografia, nanomanipulacja

9. Celki elektrochemiczne

10. Jednoczesny pomiar topografii i sił elektrostatycznych w trybie dynamicznego kontaktu

11. Automatyczny lub półautomatyczny tryb pomiaru

12. Stoliki temperaturowe pomocne w badaniu przejść fazowych

Dokładny opis przedmiotu zamówienia znajduje się w rozdziale II Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

II.1.3) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) (podano w pierwotnym ogłoszeniu)

	Słownik główny	Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)
Główny przedmiot	38500000	
Dodatkowe przedmioty	38510000	

**Dostawa fabrycznie nowego mikroskopu badawczego STM/AFM z rozszerzoną gwarancją oraz szkoleniem instruktażowym dla Laboratorium Nanomateriałów w ramach Projektu "Centrum Zaawansowanych Technologii Pomorze"
SEKCJA IV: PROCEDURA**

IV.1) RODZAJ PROCEDURY

IV.1.1) Rodzaj procedury (podano w pierwotnym ogłoszeniu)

- Otwarta
- Ograniczona
- Ograniczona przyspieszona
- Negocjacyjna
- Negocjacyjna przyspieszona
- Dialog konkurencyjny

IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.2.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą /podmiot zamawiający (podano w pierwotnym ogłoszeniu, o ile dotyczy)

[CRZP/478/004/D/10](#)

IV.2.2) Dane referencyjne ogłoszenia w przypadku ogłoszeń przesłanych drogą elektroniczną (jeżeli są znane):

Pierwotne ogłoszenie przesłane przez:

- SIMAP
- OJS eSender

Login: [ENOTICES_joajacki](#)

Dane referencyjne ogłoszenia: [2010-146883](#) (rok i numer dokumentu)

IV.2.3) Ogłoszenie, którego dotyczy niniejsza publikacja (jeżeli dotyczy)

Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2010/S	z dnia	(dd/mm/rrrr)
217-332801	09/11/2010	

IV.2.4) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

[05/11/2010](#) (dd/mm/rrrr)

Dostawa fabrycznie nowego mikroskopu badawczego STM/AFM z rozszerzoną gwarancją oraz szkoleniem instruktażowym dla Laboratorium Nanomateriałów w ramach Projektu "Centrum Zaawansowanych Technologii Pomorza" SEKCJA VI: INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE

VI.1) OGŁOSZENIE DOTYCZY

(o ile ma zastosowanie; zaznaczyć tyle punktów, ile jest to konieczne)

- Procedury niepełnej
 Sprostowania
 Informacji dodatkowych

VI.2) INFORMACJE NA TEMAT NIEPEŁNEJ PROCEDURY UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

(o ile ma zastosowanie; zaznaczyć tyle punktów, ile jest to konieczne)

<input type="radio"/> Postępowanie o udzielenie zamówienia została przerwane.
<input type="radio"/> Postępowanie o udzielenie zamówienia uznano za nieskuteczne.
<input type="radio"/> Zamówienia nie udzielono.
<input type="radio"/> Zamówienie może być przedmiotem ponownej publikacji.
<input type="radio"/> Wszystkich części
<input type="radio"/> Jednej lub więcej części

VI.3) INFORMACJE DO POPRAWIENIA LUB DODANIA

(o ile dotyczy; należy określić miejsce, w którym tekst lub daty mają być zmienione lub dodane, proszę zawsze podawać odpowiedni numer sekcji i akapitu pierwotnego ogłoszenia)

VI.3.1) Zmiana oryginalnej informacji lub publikacja w witrynie TED niezgodna z oryginalnymi informacjami.

- Zmiana oryginalnej informacji podanej przez instytucję zamawiającą
 Publikacja w witrynie TED niezgodna z oryginalną informacją, przekazaną przez instytucję zamawiającą
 W obu przypadkach

VI.3.2) Ogłoszenie lub odpowiednia dokumentacja przetargowa

- W ogłoszeniu pierwotnym
 W odpowiedniej dokumentacji przetargowej (więcej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej)
 W obu przypadkach (więcej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej)

VI.3.3) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu (jeżeli dotyczy)

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:	Zamiast:	Powinno być:
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA, II.1.5) Krótki opis przedmiotu zamówienia lub zakupu (ów)	pkt. 10 Zintegrowany mikroskop optyczny o rozdzielczości min. 1 mikrometr Dodatkowe parametry pożądane: pkt 3. Mikroskopia pojemnościowa w trybie dC/dZ oraz dC/Dv pkt. 4 Mikroskopia rezystancji rozptywu z zastosowaniem wzmacniacza logarymicznego pkt. 9 Celki elektrochemiczne	pkt. 10 Zintegrowany układ optyczny o rozdzielczości min. 1,6 µm Dodatkowe parametry pożądane: pkt. 3. Mikroskopia pojemnościowa w trybie dC/dV lub dC/dZ pkt. 4 Mikroskopia rezystancji rozptywu z zastosowaniem wzmacniacza logarymicznego. Zamawiający dopuszcza dodatkowo rozwiązanie: zastosowanie wzmacniacza liniowego o co najmniej dwóch zakresach wzmocnienia.

Dostawa fabrycznie nowego mikroskopu badawczego STM/AFM z rozszerzoną gwarancją oraz szkoleniem instruktazowym dla Laboratorium Nanomaterialów w ramach Projektu "Centrum Zaawansowanych Technologii Pomorze"

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:	Zamiast:	Powinno być:
		pkt. 9 Min. 2 celki elektrochemiczne

VI.3.4) Daty, które należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu (jeżeli dotyczy)

Miejsce, w którym znajdują się zmieniane daty:	Zamiast:		Powinno być:	
	(dd/mm/rrrr)	(gg:mm)	(dd/mm/rrrr)	(gg:mm)
IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu	16/12/2010	09:30	04/01/2011	09:30
IV.3.8) Warunki otwarcia ofert	16/12/2010	11:00	04/01/2011	10:00

Dostawa fabrycznie nowego mikroskopu badawczego STM/AFM z rozszerzoną gwarancją oraz szkoleniem instruktażowym dla Laboratorium Nanomateriałów w ramach Projektu "Centrum Zaawansowanych Technologii Pomorza"
VI.3.5) Adresy i punkty kontaktowe, które należy poprawić (jeżeli dotyczy)

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:	
Oficjalna nazwa:	
Adres pocztowy:	
Miejscowość:	Kod pocztowy:
Kraj:	
Punkt kontaktowy:	Tel.:
Osoba do kontaktów:	
E-mail:	Faks:
Adres(y) internetowy(e) (jeżeli dotyczy)	
Ogólny adres instytucji zamawiającej (URL):	
Adres profilu nabywcy (URL):	

VI.3.6) Tekst, który należy dodać do pierwotnego ogłoszenia (jeżeli dotyczy)

Miejsce, w którym należy dodać tekst	Tekst do dodania

VI.4) INNE DODATKOWE INFORMACJE (jeżeli dotyczy)

VI.5) DATA WYSŁANIA NINIEJSZEGO OGŁOSZENIA:

07/12/2010 (dd/mm/rrrr)